

XSPA-400 ER

X-ray Seamless Pixel Array detector



画期的なシームレス多次元ピクセル検出器

0,1,2次元測定可能なピクセル検出器でありながら、高いエネルギー分解能を実現

◆特長

① 高いエネルギー分解能

✓ 低BG(バックグラウンド)測定を実現

② ピクセル多次元検出器

✓ 0, 1, 2次元測定が可能

③ 広いダイナミックレンジ

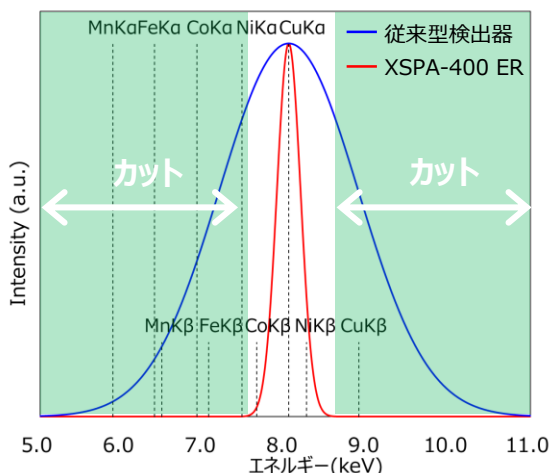
✓ 低強度から高強度まで検出可能
✓ 高い直線計数性を実現

④ フィルターレス測定

✓ K β フィルターレスの測定が可能

⑤ 多様な測定モード

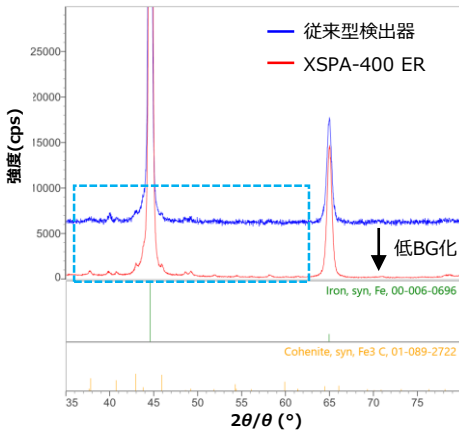
✓ 目的に応じた測定モード選択
・高強度優先モード、
・高角度分解能優先モード
✓ 工具不要の簡便な切替機能



高いエネルギー分解能により、緑色領域内に含まれる遷移金属由来の蛍光X線をカットし、BG成分を低減可能

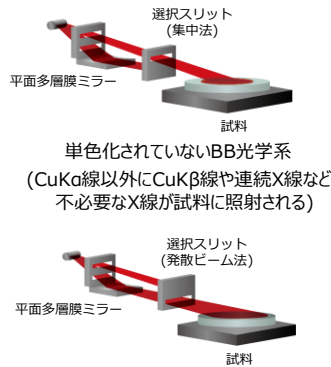
◆高いエネルギー分解能

CrMo鋼中のセメントイト定量
低BGにより、S/N比が向上し微量相を観測

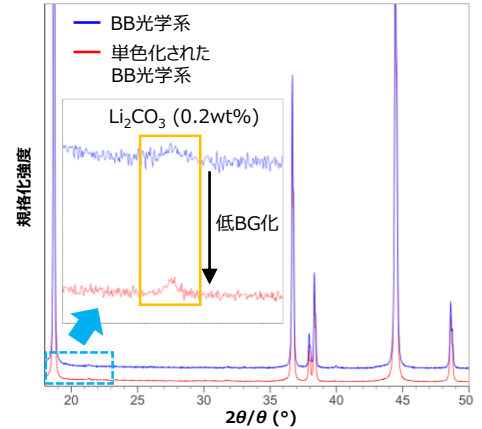


◆XSPA-400 ER × CBO-αのベストコンビネーション

正極材Li(Ni,Mn,Co)O₂の測定
CBO-αを用いて、更なる低BGのデータを取得し、微量相の検出に貢献

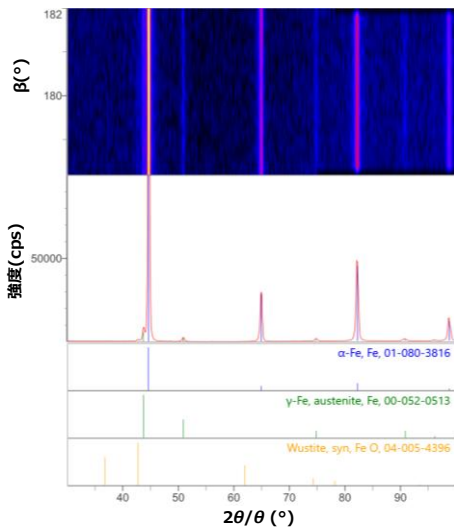


CBO-αを使用しCuKα線に単色化されたBB光学系
(X線回折に必要なCuKα線のみ試料に照射できる)



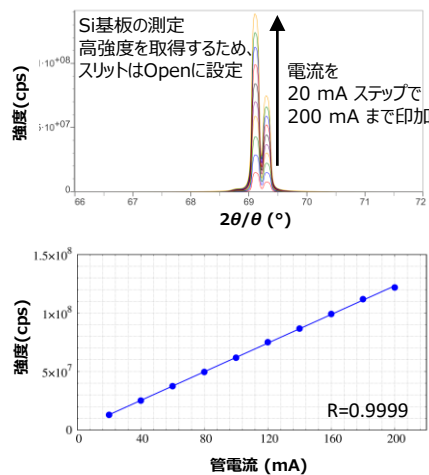
◆シームレス ピクセル多次元検出器

鉄鋼中の残留オーステナイト定量、
低BG×2次元測定を用いた応用測定が可能



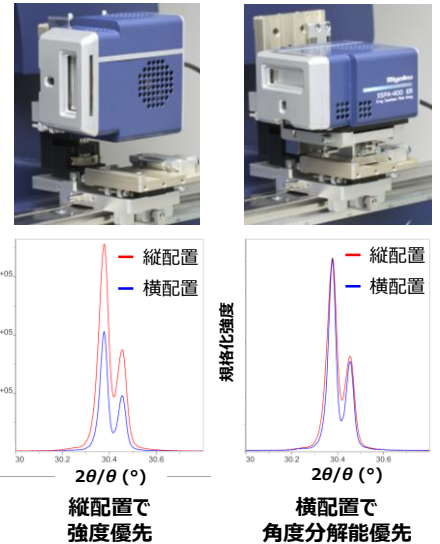
◆高い直線計数性と 広いダイナミックレンジ

低強度から高強度まで
高い直線計数性と広いダイナミックレンジ



◆強度/角度分解能優先モードを 簡単に切り替え可能

検出器の配置を1つの台座で切替でき、強度
優先・角度分解能優先のモードを選択可能



技術仕様	
検出方式	直接検出型フォトンカウンティング
検出素子	シリコン
ピクセルサイズ	75 μm × 75 μm
ピクセル数	512 × 128
検出面積	38.4 × 9.6=368.64 mm ²
計数率	> 1 × 10 ⁵ cps/pixel

技術仕様	
内蔵カウンター	最大28 bit/pixel
対応波長	Cr,Co,Cu,Mo,Ag
検出効率 (CuKα)	99 %
エネルギー分解能 (CuKα)	340 eV (蛍光X線低減モード使用時)
冷却方式	空冷
消費電力	DC20V 1.0 A (20 W)

製品改良にとまひ、やむをえず仕様・外観などを予告なく変更させていただきます。ご了承ください。

※カタログ中の社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

お問い合わせ先

株式会社 **リガク** 〒196-8666 東京都昭島市松原町 3-9-12
☎(042)545-8111 (代表電話案内) FAX(042)544-9795

東京支店 / 〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷 5-32-10 ☎(03)5312-7077 FAX(03)5312-7078
大阪支店 / 〒569-1146 高槻市赤大路町 14-8 ☎(072)696-3387 FAX(072)694-5852
東北営業所 / 〒980-0804 仙台市青葉区大町 1-2-16 ☎(022)264-0446 FAX(022)223-1977
名古屋営業所 / 〒461-0002 名古屋市東区代官町 35-16 ☎(052)931-8441 FAX(052)931-2689
九州営業所 / 〒802-0000 北九州市小倉北区堺町 2-1-1 ☎(093)541-5111 FAX(093)541-5288

URL <https://www.rigaku.com>